

Test Probe

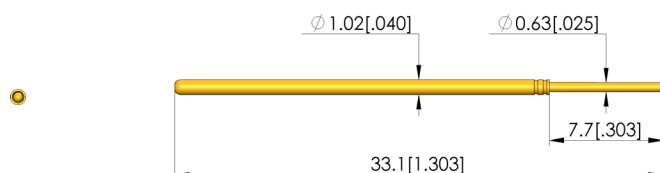
GKS-075 305 064 A 2800

Article GKS-075-0123

- Pointes de test confirmées à des millions d'exemplaires, pour mettre les cartes électroniques en contact
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions.
- Différentes forces de ressort disponibles, ainsi que des variantes avec ressort en acier inoxydable pour les hautes températures
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact



1:1



Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Course standard GKS
Série:	GKS-075
Trame:	1,91 mm
Mise en contact de:	Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-075
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	0,64 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	4 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	33,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,02 mm
Course maximale:	6,35 mm
Précontrainte ressort:	0,86 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	2,8 N
Course de travail recommandée:	4,3 mm

